

Monolithisches Röntgeninterferometer

Vortrag am Donnerstag, 24.05.2007 um 19:00 Uhr

Dr. Ulrich Kuetgens

Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Arbeitsgruppe "Bestimmung der Avogadrokonstante" (Braunschweig)

Silizium - ein perfektes Lineal für die Nanowissenschaft

Die Silizium-Technologie eignet sich hervorragend für die Herstellung von Maßverkörperungen. Sie stellt Abmessungen bereit, die für Strukturen in der Mikro- und Nanotechnik typisch sind. Als Werkstoff für eine Maßverkörperung von Längen besitzt Silizium eine Anzahl von Eigenschaften, die zusammen mit den Möglichkeiten der Präzisionsbearbeitung die Realisierung von "naturgebundenen Maßstäben" möglich macht.

Einige relevante Gesichtspunkte, die für Silizium in diesem Anwendungsfall sprechen, sind Eigenschaften die andere natürliche oder künstliche Kristalle nur eingeschränkt oder gar nicht besitzen. Als Werkstoff für elektronische Bauteile wird Silizium mit einem nahezu perfekten und störstellenfreien Kristallgitter in der industriellen Massenproduktion hergestellt. Durch seine monokristalline Struktur verhält sich Silizium z.B. in mikromechanischen Komponenten wie ein ideal elastischer Festkörper.



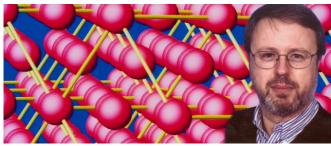
Gezogener Silizium- Einkristall

Prazisions- Siliziumbearbeitung

Andere wichtige Eigenschaften sind beispielsweise die geringe Dichte, die geringe thermische Ausdehnung, die nur von Quarzglas und von Invar unterboten wird, und die relativ hohe Härte. Die Korrosion beeinträchtigt ebenfalls die Brauchbarkeit eines Werkstoffs für Normale. Silizium wird dagegen durch seine dünne, aber sehr dichte Oxidschicht sicher passiviert. Besondere Vorteile bietet der Einsatz von Silizium wegen der Verfügbarkeit geeigneter Kristallstäbe und Bearbeitungstechnologien. Der Vortrag gibt Einblicke in die Herstellung von

Siliziumkristallen, erläutert die besonderen Eigenschaften dieser Kristalle und stellt Messmöglichkeiten und Anwendungsbereiche vor.

Die hergestellten Siliziumkörper sind durch eine homogene und zeitlich stabile Dichte charakterisiert. Der Gitterparameter von Silizium liegt in der gleichen Größenordnung wie die Wellenlänge von Röntgenstrahlung. Nach den Grundlagen der Röntgenbeugungsmethoden wird die Anwendung zur Längenmessung in sog. Röntgeninterferometern, die als interferentielle Gittermaßstäbe wirken, betrachtet. Diese Erkenntnisse können für die Bestimmung von Naturkonstanten, wie z.B. der Avogadrokonstanten genutzt werden. Dabei werden sowohl perfekte Körper -Siliziumkugeln- als auch die Eigenschaften des Kristallgitters eingesetzt. Es wird ein kurzer Überblick über dieses Projekt gegeben, das zu einer Neudefinition der SI-Einheit der Masse "Kilogramm" beitragen könnte.



Kristallgitterstruktur von Silizium

Dr. Ulrich Kuetgens

1958 geboren in Aachen

1978 Studium der Physik in Bonn

1983 Diplomarbeit im Bereich der Wellenlängenmessung von Laserlicht

1984 Dipl.-Phys.

1985 Doktorarbeit am Physikalischen Institut der Universität Bonn, Gebiet der Röntgenspektroskopie mit Synchrotronstrahlung

1990 Promotion zum Dr. rer. nat.

1991 Eintritt in die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig mit den Arbeitsgebieten: Siliziumbearbeitung, Röntgeninterferometrie, Si-Gitterparametervergleiche, Messung des Si-Gitterparameters (Avogadroprojekt), Diffraktometrie

Seit 2004 Leiter der Arbeitsgruppe Röntgenoptik

Weitere Termine

21.06.2007 Lichtlenksysteme auf der Basis von

Mikrospiegelarrays

Prof. Dr. Hartmut Hillmer

Universität Kassel

20.09.2007 Partikel - Bausteine für Mikro- und

Nanostrukturen

Prof. Dr. Arno Kwade,

Technische Universität Braunschweig

18.10.2007 Neuartige mikromechanische und

nanotechnologische Komponenten für die Sensorik, Informations- und

Medizintechnik

Prof. Dr. Hartmut Hillmer,

Universität Kassel

Änderungen vorbehalten. Bitte entnehmen Sie die aktuellen Informationen unserer Internetseite: www.upob.de/deutsch/aktivitaeten/Vortragsreihe.htm

Möchten Sie einen Vortrag halten oder einen anderen Beitrag leisten? Den Flyer per Mail erhalten? Wenden Sie sich bitte an untenstehende Adresse.

Ansprechpartner

Heiko Klawitter
Email: klawitter@upob.de
Tel. +49 (0) 531 592 5131

CC UPOB e.V. Bundesallee 100 38116 Braunschweig

http://www.upob.de/

Veranstaltungsort



Foto: BLM

Veranstaltungsort:

Forum des Braunschweigischen Landesmuseums

Burgplatz 1 38100 Braunschweig



24.05.2007 um 19:00 Uhr

Der Eintritt ist frei.

Veranstalter: Nanotechnologie Kompetenzzentrum

CC UPOB e.V.

gefördert von: Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Braunschweigisches Landesmuseum



Vortragsreihe

"Mikro- und Nanotechnik für die Gesellschaft"

Silizium ein perfektes Lineal für die Nanowissenschaft

Dr. Ulrich Kuetgens







